

UAB „Multilabo“
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Registracijos adresas: A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius;
Korespondencijos adresas: Teatro g. 11-1 LT-03107 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291, El. p.
info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Vilniaus universitetui

Žemų dažnių Ramano ir liuminiscencijos spektrometrinės sistemos pirkimas, Nr. VU10770

PASIŪLYMO FORMA

2019 m. balandžio 04 d. Nr. 1
Vilnius

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Multilabo“
Tiekėjo įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių įmonių kodus)	302325611
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	Registracijos adresas: Teatro g. 11-1 LT-03107 Vilnius Korespondencijos adresas: A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius
Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Grupės vadovas Vaidas Pudžaitis
Kontaktinio asmens telefono numeris	(8~5) 250 0291
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	info@multilab.lt

/Pastaba. Pildoma, jei ketinamas pasitelkti subtiekęjas (-ai)/kiti asmenys, kurių pajėgumais remiamasi

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	
Subtiekęjui (-ams) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. pirkimo sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes patvirtindami, jog į nurodytas kainas įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi pardavėjo mokėtini mokesčiai:

2.1. *lentelė. Siūloma kaina:*

2. Mes siūlome šias prekes patvirtindami, jog į nurodytas kainas įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi pardavėjo mokėtini mokesčiai:

2.1. lentelė. Siūloma kaina:

EEil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės kaina, Eur be PVM
11.	Žemų dažnių Ramano ir liuminiscencijos spektrometrinės sistema, 1 vnt. [Monovista CRS+, Spectroscopy & Imaging GmbH]	339000,00
22.	PVM ¹⁾ 21 % (eurais)	71190,00
33.	IŠ VISO ²⁾ (bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM)	410190,00

¹⁾ tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

²⁾ Lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina. Jei tiekėjas pateiks pasiūlymo kainas be PVM, o pristatys prekes/suteikus paslaugas/atlikus darbus, PVM turės būti mokamas perkančiosios organizacijos, prie tiekėjo pasiūlymo palyginamosios kainos bus pridėdama mokėtina PVM suma

* Pažymime, kad prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

Techninė specifikacija

1. Bendra informacija

Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „Spectrometrinio medžiagų / molekulių vyksmų charakterizavimo centras (SPECTROVERSUM)“ Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-05-0001, numato pirkti žemų dažnių Ramano ir liuminescencijos mikrospektroskopijos sistemą, 1 vnt.

2. Atitikimas techniniams reikalavimams

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis.

Eil. Nr.	Rodiklis	Rodiklio parametrai	Pardavėjo siūlomos charakteristikos
1.	Paskirtis	Spektrinės mikroskopijos sistema skirta skystų ir kietų ir dujinių bandinių Ramano sklaidos bei liuminescencijos spektrų ir spektrinių žemėlapių registravimui su didele paviršine skyra, pasiekiant žemadažnę Ramano poslinkio skaičių iki 10 cm^{-1} sritį	Spektrinės mikroskopijos sistema skirta skystų ir kietų ir dujinių bandinių Ramano sklaidos bei liuminescencijos spektrų ir spektrinių žemėlapių registravimui su didele paviršine skyra, pasiekiant žemadažnę Ramano poslinkio skaičių iki 10 cm^{-1} sritį
2.	Veikimo principas	Konfokalinė difrakcinė mikrospektroskopijos sistema	Konfokalinė difrakcinė mikrospektroskopijos sistema
3.	Paviršinė skiriamoji geba (XY)	Geresnė nei 2 mikrometrai ($\leq 2\mu\text{m}$)	2 mikrometrai ($\leq 2\mu\text{m}$)
4.	Mikroskopo tipas	Konfokalinis atspindžio mikroskopas, su ne mažiau kaip 3 pozicijom skirtoms sumontuoti skirtingus objektivyvus.	Konfokalinis atspindžio mikroskopas, su 6 pozicijom skirtoms sumontuoti skirtingus objektivyvus.
4.1.	Mikroskopo objektyvai:	Ne mažiau nei trys 10x, 40x ir 100x objektyvai.	Trys 10x, 40x ir 100x objektyvai.
4.2.	10 x objektivas	Skaitinė apertūra (NA) ne mažesnė nei 0,30 Darbinis atstumas (WD) 11 mm ± 1 mm	Skaitinė apertūra (NA) 0,30 Darbinis atstumas (WD) 11,6 mm
4.3.	40 x objektivas	Skaitinė apertūra (NA) ne mažesnė nei 0,80 Darbinis atstumas (WD) 0,5 mm $\pm 0,1$ mm	Skaitinė apertūra (NA) 0,80 Darbinis atstumas (WD) 0,51 mm
4.4.	100 x objektivas	Skaitinė apertūra (NA) ne mažesnė nei 0,75 Darbinis atstumas (WD) 3,5 mm $\pm 0,2$ mm	Skaitinė apertūra (NA) 0,80 Darbinis atstumas (WD) 3,4 mm
5	Vaizdo kamera mėginio vaizdo registravimui	Didelės skyros CCD kamera	Didelės skyros CCD kamera
6	Mėginio stalis	Pilnai automatizuotas X-Y-Z, su automatinio fokusavimo galimybe. Eiga - ne mažesnė nei 120 x 80 mm, Žingsnis (XYZ kryptimis) - ne didesnis nei 0,05 μm	Pilnai automatizuotas X-Y-Z, su automatinio fokusavimu. Eiga - 120 x 80 mm, Žingsnis (XYZ kryptimis) - 0,05 μm
7	Spektrinė skyra	Geresnė nei $1,0\text{ cm}^{-1}$ ($\leq 1,0\text{ cm}^{-1}$) ties 532 nm Geresnė nei $0,6\text{ cm}^{-1}$ ($\leq 0,6\text{ cm}^{-1}$) ties 633 nm Geresnė nei $1,0\text{ cm}^{-1}$ ($\leq 1,0\text{ cm}^{-1}$) ties 785 nm	$1,0\text{ cm}^{-1}$ ($\leq 1,0\text{ cm}^{-1}$) ties 532 nm $0,6\text{ cm}^{-1}$ ($\leq 0,6\text{ cm}^{-1}$) ties 633 nm $0,8\text{ cm}^{-1}$ ($\leq 0,8\text{ cm}^{-1}$) ties 785 nm
8	Ramano spektras žadinti naudojami lazeriai	Sistemos viduje sumontuoti ne mažiau nei 4: 457nm, 532nm, 633nm 785nm bangos ilgio lazeriai. Lazeriai turi būti lengvai keičiami, pilnai valdomi programinės įrangos pagalba. Lazero pakeitimas turi būti atliekamas be papildomo rankinio sistemos justiravimo	Sistemos viduje sumontuoti 4: 457nm, 532nm, 633nm 785nm bangos ilgio lazeriai. Lazeriai lengvai keičiami, pilnai valdomi programinės įrangos pagalba. Lazero pakeitimas atliekamas be papildomo rankinio sistemos justiravimo
8.1.	Sistemoje instaliuotų lazerių parametrai	1. Bangos ilgis 457 $\pm$ 1 nm, galia ≥ 50 mW 2. Bangos ilgis 532 $\pm$ 1nm, galia ≥ 500 mW 3. Bangos ilgis 633 $\pm$ 1 nm, galia ≥ 30 mW 4. Bangos ilgis 785 $\pm$ 1nm, galia ≥ 100 mW	1. Bangos ilgis 457 nm, galia 50 mW 2. Bangos ilgis 532 nm, galia 500 mW 3. Bangos ilgis 633 nm, galia 35 mW 4. Bangos ilgis 785 nm, galia 100 mW
8.2.	Lazerių filtrai	Ne mažiau nei 5 filtrai pritaikyti sistemoje sumontuotiems lazeriams: 8.2.1. 457nm lazerio filtras leidžiantis atlikti matavimus esant ne didesniai nei 100 cm^{-1} Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinės įrangos pagalba. 8.2.2. 532nm lazerio filtras leidžiantis atlikti matavimus esant ne didesniai nei 60 cm^{-1} Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinės įrangos pagalba. 8.2.3. 633nm lazerio filtras leidžiantis atlikti matavimus esant ne didesniai nei 60 cm^{-1} Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinės įrangos pagalba. 8.2.4. 785nm lazerio filtras leidžiantis atlikti matavimus esant ne didesniai nei 60 cm^{-1} Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinės įrangos pagalba. 8.2.5. 532nm lazerio filtras leidžiantis atlikti matavimus esant ne didesniai nei 10 cm^{-1} poslinkiui, su galimybe registruoti anti-Stokso Ramano sklaidos spektrus	5 filtrai pritaikyti sistemoje sumontuotiems lazeriams: 8.2.1. 457nm lazerio filtras leidžiantis atlikti matavimus esant 60 cm^{-1} Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinės įrangos pagalba. 8.2.2. 532nm lazerio filtras leidžiantis atlikti matavimus esant 60 cm^{-1} Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinės įrangos pagalba. 8.2.3. 633nm lazerio filtras leidžiantis atlikti matavimus esant 60 cm^{-1} Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinės įrangos pagalba. 8.2.4. 785nm lazerio filtras leidžiantis atlikti matavimus esant 60 cm^{-1} Stokso poslinkiui. Filtras valdomas programinės įrangos pagalba. 8.2.5. 532nm lazerio filtras leidžiantis atlikti matavimus esant 10 cm^{-1} poslinkiui, su galimybe registruoti anti-Stokso Ramano sklaidos spektrus
8.3.	Lazerinės spinduliuotės pasiekiančios bandinį reguliavimas	Programiškai valdomi filtrai leidžiantys žadinimo intensyvumą reguliuoti ne siauresnėse ribose nei nuo 100% iki 0,000001%.	Programiškai valdomi filtrai leidžiantys žadinimo intensyvumą reguliuoti ribose nuo 100% iki 0,000001%.

9.1.	Difrakcinės gardelės	Ne mažiau nei 3 prietaiso viduje sumontuotos ir automatiškai keičiamos difrakcinės gardelės. Difrakcinių gardelių parametrai: 9.1.1. Gardelė pilno spektro registravimui, nejudinant gardelės – sritis ne siauresnė nei 0-4000 cm ⁻¹ 9.1.2. Gardelė optimizuota 532 nm lazeriui. Pasiekama spektrinė skyra ne blogesnė nei 1,0 cm ⁻¹ (≤1,0 cm ⁻¹) 9.1.3. Gardelė optimizuota 785 nm lazeriui. Pasiekama spektrinė skyra ne blogesnė nei 1,0 cm ⁻¹ (≤1,0 cm ⁻¹)	3 prietaiso viduje sumontuotos ir automatiškai keičiamos difrakcinės gardelės. Difrakcinių gardelių parametrai: 9.1.1. Gardelė pilno spektro registravimui, nejudinant gardelės – sritis 0-4000 cm ⁻¹ 9.1.2. Gardelė optimizuota 532 nm lazeriui. Pasiekama spektrinė skyra ne blogesnė nei 1,0 cm ⁻¹ (≤1,0 cm ⁻¹) 9.1.3. Gardelė optimizuota 785 nm lazeriui. Pasiekama spektrinė skyra ne blogesnė nei 1,0 cm ⁻¹ (≤1,0 cm ⁻¹)
9.2.	Spektrometro židinio nuotolis	Ne mažesnis nei 500 mm	500 mm
9.3.	Spektrometro optinė sistema	Optinio signalo perdavimas ir fokusavimas atliekamas veidrodžių sistema.	Optinio signalo perdavimas ir fokusavimas atliekamas veidrodžių sistema.
9.3.	Optinį signalą perduodančių veidrodžių danga	Sidabras, arba ekvivalentių optinių savybių 400-800 nm bangos ilgių spektrinėje srityje medžiaga.	Sidabras 400-800 nm bangos ilgių spektrinėje srityje medžiaga.
9.4.	Vaizdo korekcijos sistema	Vaizdo iškraipymų atsirandančių fokusuojant spinduliuotę sistema, pagrįsta toroidiniais veidrodžiais arba ekvivalentia technologija	Vaizdo iškraipymų atsirandančių fokusuojant spinduliuotę sistema, pagrįsta toroidiniais veidrodžiais.
10	Polarizatoriai	Turi būti valdomi programinės įrangos pagalba. Polarizatorius ir analizatorius turi būti optimizuoti 532nm bei 785 nm bangos ilgiams, Ramano spektrų registravimui esant VV (vertikali apšvietimo ir vertikali detekcijos) ir VH (vertikali apšvietimo ir horizontali detekcijos) polarizacijoms.	Valdomi programinės įrangos pagalba. Polarizatorius ir analizatorius optimizuoti 532nm bei 785 nm bangos ilgiams, Ramano spektrų registravimui esant VV (vertikali apšvietimo ir vertikali detekcijos) ir VH (vertikali apšvietimo ir horizontali detekcijos) polarizacijoms.
11	Optinio signalo jutiklis	Regimajai sričiai optimizuota šaldoma ne iki didesnės nei -120°C temperatūros spektroskopinė CCD kamera:	Regimajai sričiai optimizuota šaldoma iki -120°C temperatūros spektroskopinė CCD kamera:
11.1.	Registruojamo signalo spektrinis diapazonas	Ne siauresnė nei nuo 350 iki 1050 nm.	nuo 350 iki 1050 nm.
11.2.	Kvantinis našumas srityje nuo 400 nm iki 850 nm	ne mažesnis nei 80% matuojamas jutikliui esant ne aukštesnės nei -100°C temperatūros.	80% matuojamas jutikliui esant ne aukštesnės nei -100°C temperatūros.
11.3.	Analoginis-skaitmeninis signalo keitiklis	ne mažiau nei 16 bitų.	16 bitų.
11.4.	Jutiklio matricos taškų skaičius	Ne mažiau nei 1200 x 100	1200 x 100
11.5.	Jutiklio taško (pikselio) dydis	Ne didesnis nei 20 x 20 μm	20 x 20 μm
11.6.	Jutiklio tamsinė srovė	Ne didesnė ne 1 elektronas viename jutiklio taške (pikselyje) per valandą (matuojama -120°C, arba aukštesnėje temperatūroje)	0,3 elektrono viename jutiklio taške (pikselyje) per valandą (matuojama -120°C, arba aukštesnėje temperatūroje)
11.7.	Jutiklio tiesiškumas	Ne blogesnis nei 1%	1%
11.8.	Šviesos interferencijos detektoriuje (etaloning) kompensavimas	Jutiklio technologijoje turi būti numatytas šviesos interferencijos kompensavimas skirtingiems bangos ilgiams (low etaloning)	Jutiklio technologijoje numatytas šviesos interferencijos kompensavimas skirtingiems bangos ilgiams (low etaloning)
12	Makro bandinių matavimų skyrius	12.1. Bandinių skyrius ir optinė sistema pritaikyta atlikti matavimus naudojant 180° ir 90° Ramano sklaidos žadinimo geometriją. 12.2. Turi turėti XYZ stalių mėginio pozicionavimui. 12.3. Turi turėti optinę sistemą užtikrinančią daugkartinį spindulio praėjimą per mėginį (dujinių mėginių matavimams). 12.4. Kamera tinkama standartinių skystų azotu aušinamų kriostatų montavimui.	12.1. Bandinių skyrius ir optinė sistema pritaikyta atlikti matavimus naudojant 180° ir 90° Ramano sklaidos žadinimo geometriją. 12.2. Su XYZ staliu mėginio pozicionavimui. 12.3. Su optine sistema užtikrinančią daugkartinį spindulio praėjimą per mėginį (dujinių mėginių matavimams). 12.4. Kamera tinkama standartinių skystų azotu aušinamų kriostatų montavimui.
13	Fluorescencijos matavimo priedas	13.1. Turi turėti fluorescencijos, užlaikytos fluorescencijos, fluorescencijos žadinimo, fosforescencijos, fosforescencijos gesimo, spektrų matavimo režimus. 13.2. Šviesos šaltinis – impulsinė lempa, impulso trukmė ne daugiau 5±0,1 μs (plotis ties puse maksimumo). 13.3. Turi turėti skystų bei kietų mėginių laikiklius, šviesolaidinę zoną suderinamą su makro matavimų kamera ir mikroskopo matavimais. 13.4. Žadinimo ir emisijos spektrinė sritis ne mažesnė nei nuo 200nm iki 900nm. 13.5. Turi turėti reguliuojamą žadinimo ir emisijos plyšių plotį nuo ne daugiau nei 2nm iki ne mažiau kaip 20 nm. 13.6. Turi turėti ne mažiau nei po 4 integruotus fluorescencijos žadinimo ir fluorescencijos emisijos filtrus. 13.7. Signalų triukšmo santykis >500:1 RMS, esant 500 nm žadinimui, žadinimo ir emisijos plyšio pločiai 10±0,2 nm, vidurkinimas 1±0,1 s. 13.8. Turi turėti programinės įrangos pagalba valdomus žadinimo spinduliuotės ir emisijos spinduliuotės polarizatorius. 13.9. Turi turėti skystų mėginių laikiklį su temperatūros valdymu.	13.1. Turi fluorescencijos, užlaikytos fluorescencijos, fluorescencijos žadinimo, fosforescencijos, fosforescencijos gesimo, spektrų matavimo režimus. 13.2. Šviesos šaltinis – impulsinė lempa, impulso trukmė 1±0,1 μs (plotis ties puse maksimumo). 13.3. Turi skystų bei kietų mėginių laikiklius, šviesolaidinę zoną suderinamą su makro matavimų kamera ir mikroskopo matavimais. 13.4. Žadinimo ir emisijos spektrinė sritis nuo 200nm iki 900nm. 13.5. Turi reguliuojamą žadinimo ir emisijos plyšių plotį nuo 2nm iki 20 nm. 13.6. Turi 4 integruotus fluorescencijos žadinimo ir fluorescencijos emisijos filtrus. 13.7. Signalų triukšmo santykis 1400:1 RMS, esant 500 nm žadinimui, žadinimo ir emisijos plyšio pločiai 10 nm, vidurkinimas 1s. 13.8. Turi programinės įrangos pagalba valdomus žadinimo spinduliuotės ir emisijos spinduliuotės polarizatorius. 13.9. Turi skystų mėginių laikiklį su temperatūros valdymu.
14	Optinio signalo perdavimas	14.1. Ramano optinis signalas nuo mikroskopo iki difrakcinės gardelės turi būti perduodamas tiesiogiai nenaudojant šviesolaidinės optikos 14.2. Liuminescencijos signalas iki difrakcinės gardelės gali būti perduodamas tiesiogiai arba panaudojant šviesolaidinę optiką.	14.1. Ramano optinis signalas nuo mikroskopo iki difrakcinės gardelės perduodamas tiesiogiai nenaudojant šviesolaidinės optikos 14.2. Liuminescencijos signalas iki difrakcinės gardelės perduodamas panaudojant šviesolaidinę optiką.

15	Prietaiso valdymo ir duomenų analizės programinė įranga	Turi turėti šias funkcijas: 15.1. Prietaiso nustatymų bei matavimų valdymas įskaitant galimybę vartotojui kurti paprogrames 15.2. Automatinis bangos skaičiaus kalibravimas 15.3. Ramano spektrų XYZ registravimas bei atvaizdavimas 15.4. Automatinio fokusavimo funkcija. 15.5. Automatinio lazerių ir filtrų keitimo funkcija. 15.6. Duomenų apdorojimas bei analizė. 15.7. Duomenų eksportavimas į ASCII, Excel ir GRAMS formatus.	Turi šias funkcijas: 15.1. Prietaiso nustatymų bei matavimų valdymas įskaitant galimybę vartotojui kurti paprogrames 15.2. Automatinis bangos skaičiaus kalibravimas 15.3. Ramano spektrų XYZ registravimas bei atvaizdavimas 15.4. Automatinio fokusavimo funkcija. 15.5. Automatinio lazerių ir filtrų keitimo funkcija. 15.6. Duomenų apdorojimas bei analizė. 15.7. Duomenų eksportavimas į ASCII, Excel ir GRAMS formatus.
16	Antivibracinis stalas	Turi būti įtrauktas į komplektą, matmenis pritaikius spektrometrinės sistemos matmenims	Įtrauktas į komplektą, matmenys pritaikyti spektrometrinės sistemos matmenims
17	Spektrometrinės sistemos valdymo kompiuterinė sistema	Turi būti įtraukta į komplektą	Įtraukta į komplektą
18	Instaliacija	Tiekėjas visą įrangą turi pristatyti į laboratoriją, ją suinstaliuoti ir atlikti gamintojo numatytus sistemos veikimo patikros testus.	Tiekėjas pristato į laboratoriją, ją suinstaliuoja ir atlika gamintojo numatytus sistemos veikimo patikros testus.
19	Personalo apmokymai	Tiekėjas turi praveisti darbo su spektrometrine sistema mokymus 3-5 žmonių grupei, ne mažesnės nei 4 val. trukmės.	Pravedami darbo su spektrometrine sistema mokymai 3-5 žmonių grupei, 4 val. trukmės.
20	Garantija	Ne mažiau nei 2 metai visai sistemai. Papildoma garantija bent dviem Ramano sklaidos žadinimo lazeriams ne mažiau nei 7 metai.	2 metai visai sistemai. Papildoma garantija dviem Ramano sklaidos žadinimo lazeriams 7 metai.

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu teikiama informacija:

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Būtina (taip / ne)	Konfidencialumas (taip / ne)
1	2	3
Užpildyta pasiūlymo forma	Taip	Ne
EBVPD deklaracija (užpildyta dalyvio, kiekvieno jo jungtinės veiklos partnerio bei subtiekejo, jei tokių yra)	Taip	Ne
Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	Taip (jei jį pasirašo ne dalyvio vadovas)	Taip
Užpildyta techninė specifikacija	Taip	Taip
Gamintojo prekių aprašymas ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis, kad siūlomos prekės atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus	Taip	Taip
Jungtinės veiklos sutarties kopija	Taip (jei taikoma)	-
Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekiais patvirtinantys dokumentai	Taip (jei taikoma)	-

Pastaba: Tiekėjo nurodomas konfidencialumas perkančiajai organizacijai nėra privalomas ir bus vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Rekomendacinė informacija dėl konfidencialumo pateikiama <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie%C5%A1uosiuose-pirkimuose->.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų ir kokybės skyriaus vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Renata Radzevičienė

(Vardas ir pavardė)